

ICマルチファンクション検査対応高速OPEN/LEAKテスト IC multi Function test, High speed Open/Leak tester

IC Embedded基板に特化したスーパーテスト!
Specialized in IC Embedded substrates



LCR測定 (Option)
LCR Measurement



高速検査
High Speed

高精度
High Accuracy

IC Embeddedに特化
Specialize in Embedded
Components test

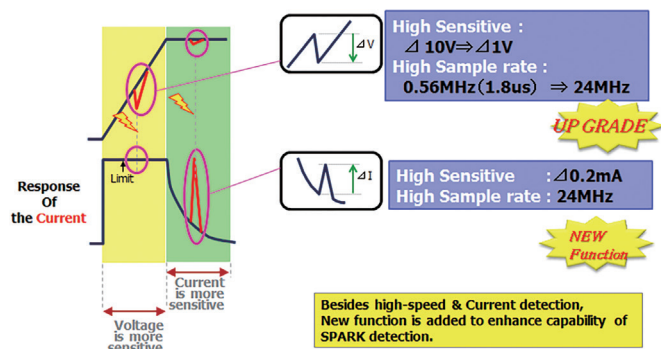
高速・高精度でIC検査も実現!

High speed and high accuracy realize IC inspection!!

高速な導通・短絡測定、 $\mu\Omega$ 精度と高速検査の4端子測定、all-CH LCR測定に加え、
高精度のIC検査で多様化するニーズにお応えします!

From Low Voltage to High Voltage, Low Resistance to High Resistance Open/Leak Wide Range Measurement Testing, to $\mu\Omega$ Accuracy and High Speed 4-Wire Measurement, All-CH LCR Measurement, IC Embedded components test, Those Diversification Measurement is Available!

電流検出 & 高速サンプリング Current detection & high speed sampling



SMU (Source Measure Unit)

Specialize in Embedded Components test

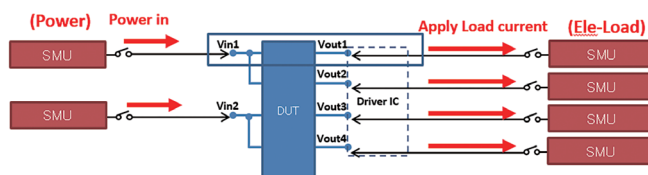
最大16個のSMUを電源並びに電子負荷としてDUTに接続することでパワーON/OFFのシーケンスを実現。

また、SMUを自由に組合せたDUT測定が可能です。

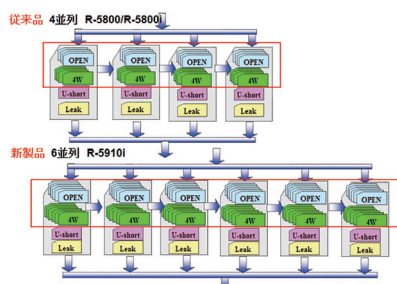
Up to 16 SMUs as power supply and electronic load to DUT

A power ON / OFF sequence is realized by connecting.

DUT measurement that can be freely combined with SMU is possible.



高速化 High speed



LCR測定 (Option) LCR Measurement

自社開発によるLCRメーター搭載。異なる特性を2つ搭載することで、高速検査(2個同時測定)が可能です。

The in-house developed LCR meter is mounted. High-speed inspection (two simultaneous measurement) is possible by being equipped with two different characteristics.

HP-4W検査

High performance 4W inspection

WR μ -SHORT検査

WR μ -SHORT inspection

μ OPEN検査

μ OPEN inspection

その他多数の検査オプションをご用意しております。